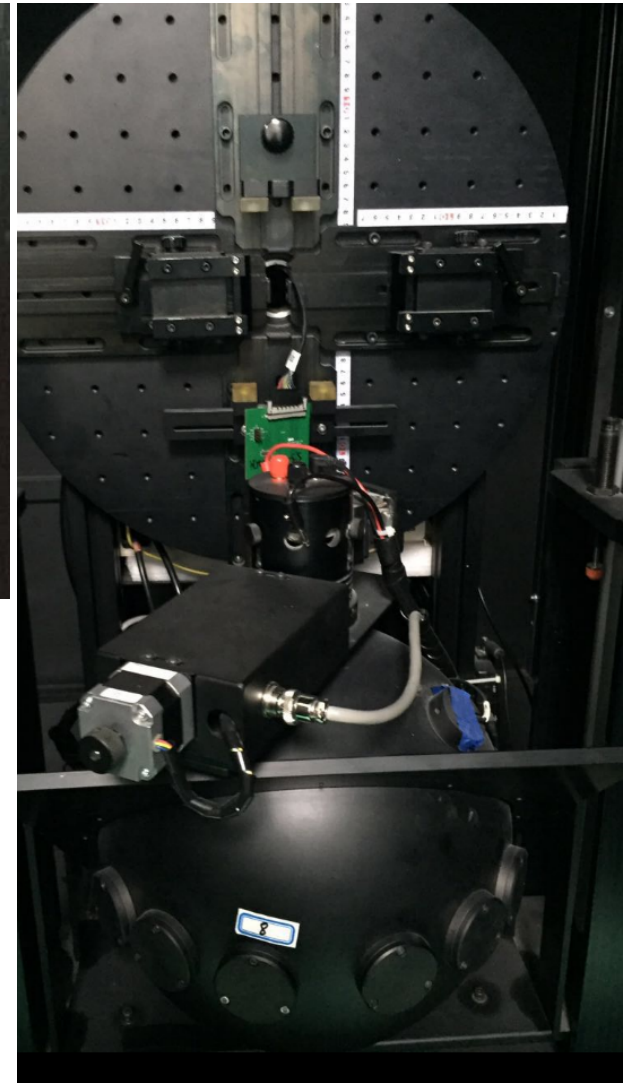




顶 级 光 电 产 品 专 业 代 理 商

Measuring System

ACR Measure System

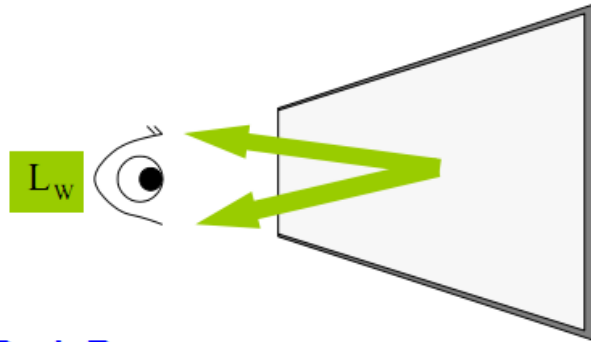


- 各角度自动测试设计
- 照度自定义测试模式设计
- ACR Graph绘制

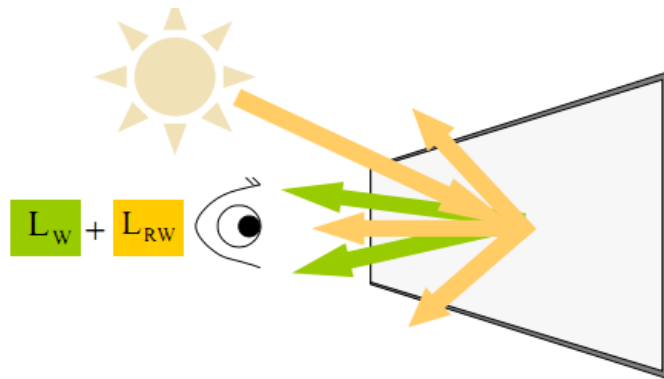
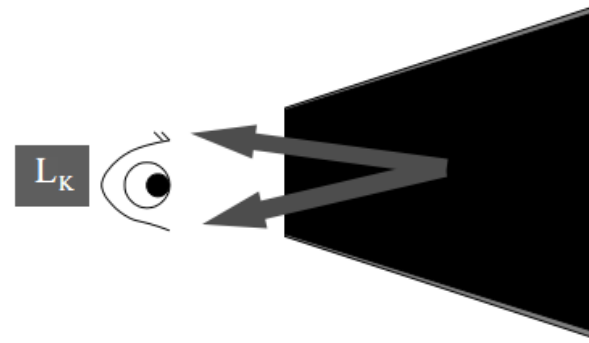
Measuring Items	
明室对比	明室对比度测试
反射率	漫反射率测试
	镜面反射率测试

Measuring System

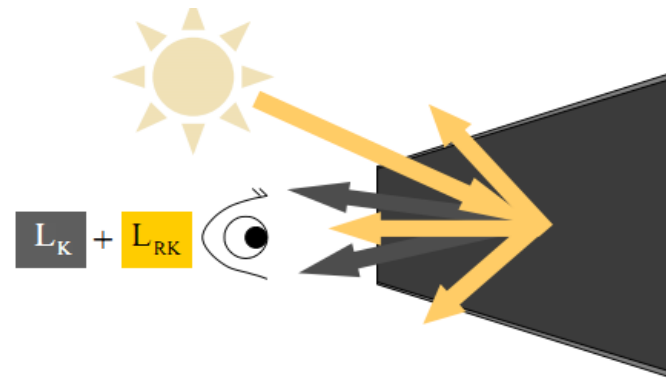
ACR Measure System



Dark Room



Under lighting environment

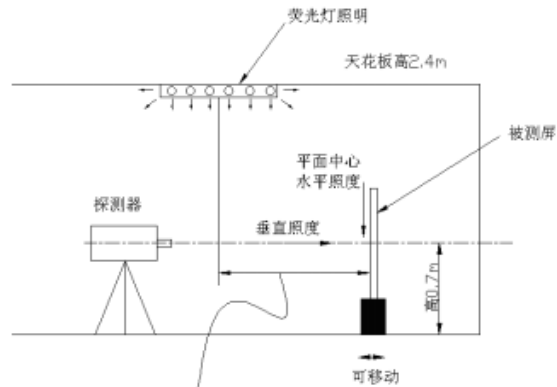


一般的对比度测试是在暗室的环境下做测试
但是大部分的产品使用上是在明亮的环境中使用,故而有明室对比的测试需求

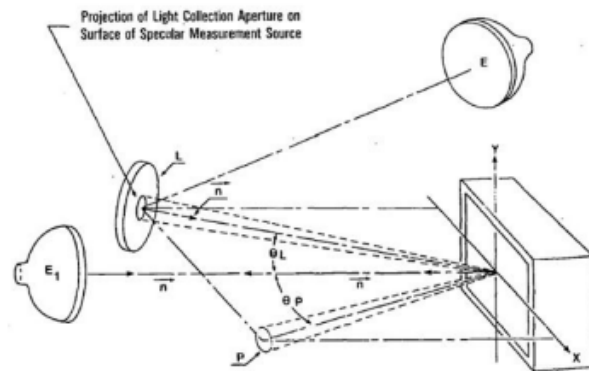
Measuring System

ACR Measure System

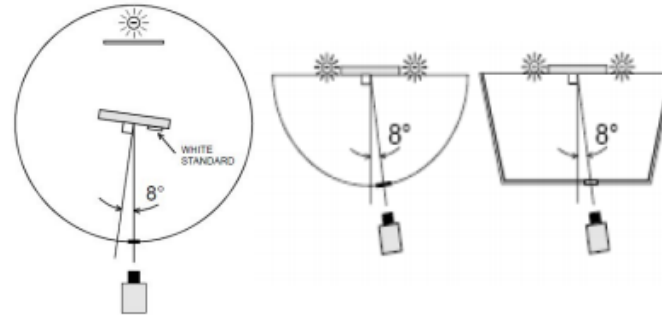
JEITA



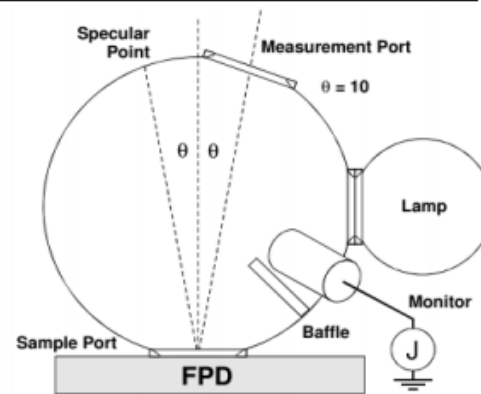
MIL



VESA



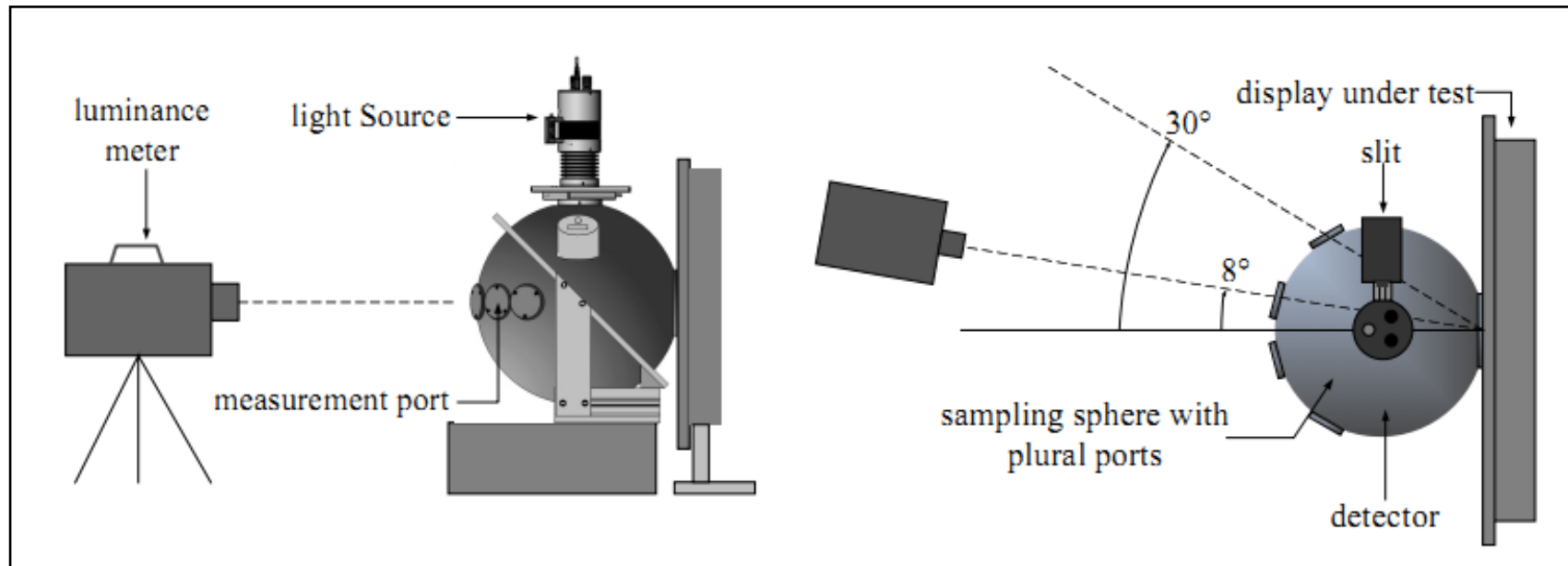
NIST



目前明室对比的测试方式有以上几种规范,我司采用的是NIST规范
测试Follow D/8规范(扩散光/8度测试)

Measuring System

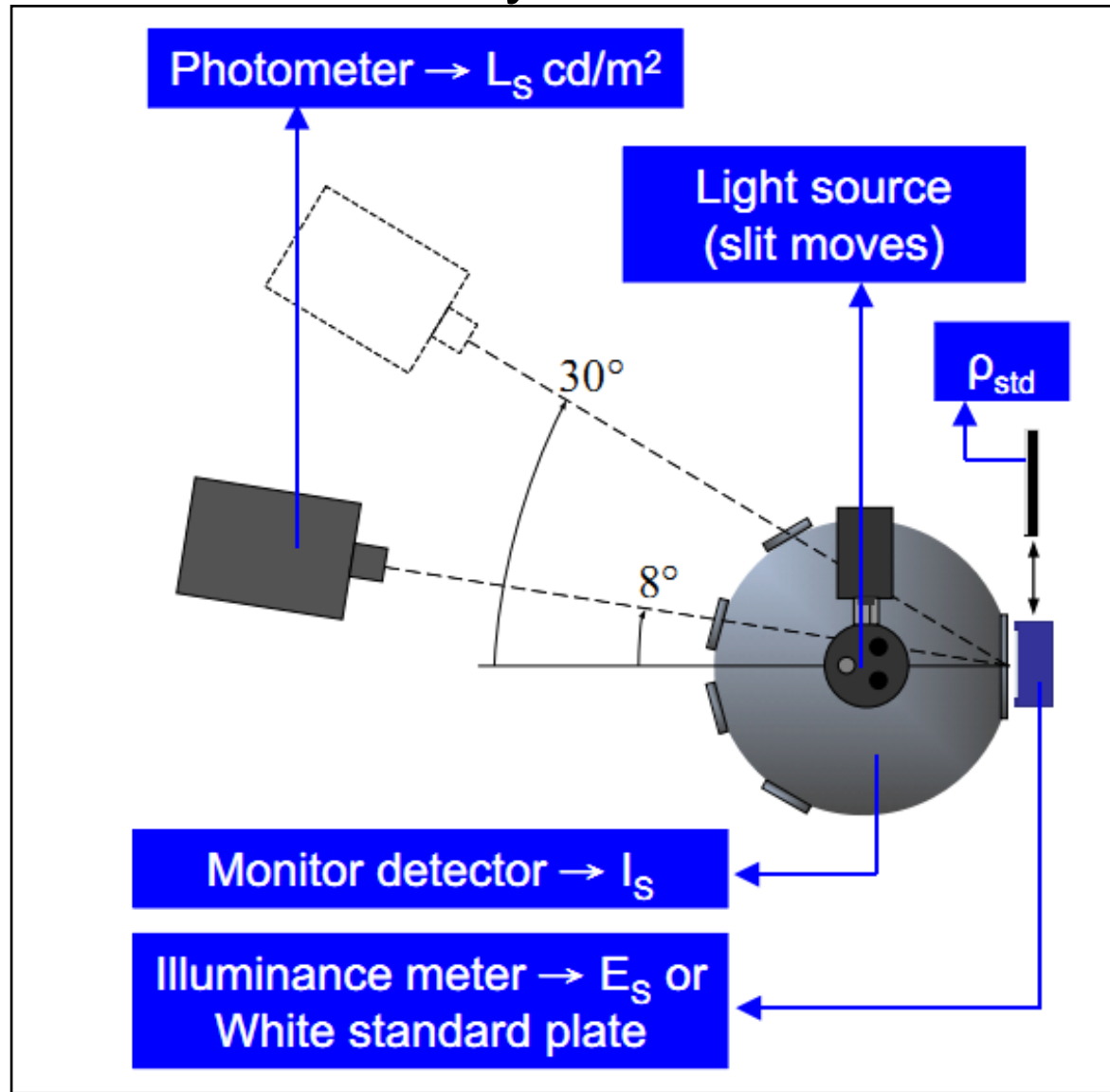
ACR Measure System



可以测试 $\pm 8^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 30^\circ$ 的明室对比

Measuring System

ACR Measure System



提供2片标准反射板
包含镜面反射*1
漫反射*1

可测试产品反射率

Measuring System

ACR Measure System

积分球↔	
1 直径↔	12"↔
2 内壁涂布↔	硫酸钡↔
3 取样开口↔	x 1, 圆形, 直径 3", 附遮盖↔
4 量测开口(客户指定)↔	x 6, 圆形, 直径 1", 水平方向位置: +/-8 度, +/-20 度 及 +/-30 度 ↓ 附遮盖 x 6↔
5 光源输入开口↔	x 1, 圆形, 直径 1", 可加上固定直径 8mm 光纤之机构. 光源出口 配置扩散板. 位置不影响量测仪器之架设↔
6 光侦测器开口↔	位置不影响量测仪器之架设↔
7 底板↔	可固定于平面之机构↔
光源↔	
1 卤素灯泡↔	> 150W↔
2 照度范围↔	0~ >100,000 lux↔
3 取样开口亮度不均匀度↔	< +/- 3% @ 5cm diameter↔
4 亮度调整机构↔	可编程遮光板↔
5 附 IR Cut Filter↔	Yes↔
6 散热装置↔	主动式温控 -- 风扇↔
光侦测器↔	
1 分辨率↔	0.01 lux↔
2 照度范围↔	0~200,000 lux↔
3 具余弦修正功能↔	Yes↔
电源供应器↔	
1 Max. Voltage↔	60V↔
2 Max. Current↔	10A↔
3 Resolution↔	1mV/0.1mA↔
4 界面↔	RS232/GPIB↔

感谢您的关注

 先锋科技
Titan Electro-Optics Co.,Ltd.

顶级光电产品专业代理商
